日 本 国 特 許 庁 19.11.2004 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年11月21日

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-392172

[ST. 10/C]:

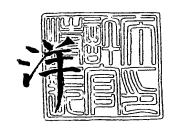
[JP2003-392172]

出 願 人
Applicant(s):

ダイキン工業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月13日





BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願 IP-14291 【整理番号】 平成15年11月21日 【提出日】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 CO8J 7/06 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作 【住所又は居所】 所内 田中 宏幸 【氏名】 【発明者】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作 【住所又は居所】 所内 野口 剛 【氏名】 【発明者】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作 【住所又は居所】 所内 東野 克彦 【氏名】 【特許出願人】 000002853 【識別番号】 ダイキン工業株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100065226 【識別番号】 【弁理士】 朝日奈 宗太 【氏名又は名称】 06-6943-8922 【電話番号】 【選任した代理人】 100098257 【識別番号】 【弁理士】 佐木 啓二 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100117112 【識別番号】 【弁理士】 秋山 文男 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 001627 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

特許請求の範囲 1

明細書 1

要約書 1

0315433

【提出物件の目録】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が40~100である軟質材料からな る基材の表面全体または一部に、金属、金属酸化物、金属チッ化物、金属炭化物およびそ れらの複合物からなる群より選ばれる1種以上の金属または金属化合物からなるコーティ ング膜を有するシール材。

【請求項2】

軟質材料が、エラストマーである請求項1記載のシール材。

【請求項3】

軟質材料が、フッ素系高分子材料である請求項1記載のシール材。

【請求項4】

軟質材料が、フッ素ゴムである請求項1、2または3記載のシール材。

【請求項5】

コーティング膜の膜厚が、0.005~1μmである請求項1、2、3または4記載のシ ール材。

【請求項6】

JIS K5600の碁盤目テープ試験(1mm角/100目)にて測定される軟質材料 とコーティング膜との剥離数が50/100以下となる密着度で、軟質材料とコーティン グ膜が密着している請求項1、2、3、4または5記載のシール材。

【請求項7】

下記条件で O_2 、 CF_4 、 NF_3 のそれぞれのプラズマを照射した時の重量減少率が、全て 1重量%以下である請求項1、2、3、4、5または6記載のシール材。

サンプル:厚さ2mm、10mm×35mmのシート

照射条件:

ガス流量・・・・・・16 S C C M O2、CF4プラズマ

圧力······20mTorr

出力・・・・・・800W

照射時間・・・・・・30分

 $NF_3/Ar \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1SLM/1SLM$ NF3プラズマ

圧力・・・・・・3 Torr 照射時間・・・・・・2時間 温度・・・・・・150℃

【請求項8】

コーティング膜が、真空成膜法により成膜される請求項1、2、3、4、5、6または7 記載のシール材。

【請求項9】

真空成膜法が、イオンプレーティング法である請求項8記載のシール材。

【請求項10】

請求項1、2、3、4、5、6、7、8または9記載のシール材を有する液晶・半導体製 造装置。

【請求項11】

ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が40~100である軟質材料からな る基材の表面全体または一部を、イオンプレーティング法により、金属、金属酸化物、金 属チッ化物、金属炭化物およびそれらの複合物からなる群より選ばれる1種以上の金属ま たは金属化合物でコーティングする工程を有するシール材の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】表面コーティングされたシール材

【技術分野】

[0001]

本発明は、表面コーティングされたシール材に関し、軟質基材の持つ強度、硬度、シー ル性を保ちつつ、耐薬品性、耐プラズマ性、非粘着性を高めたシール材に関する。

【背景技術】

[0002]

軟質材料は、自動車工業、半導体工業、化学工業などの分野において、シール材として 一般的に使用されている。しかし、これらのシール材は、各種装置に密接に接触させて使 用するため、長期間の使用により、シール材が装着された装置等に固着し、シール材の脱 着を困難にしたり、動的な箇所においては、装置の動作に悪影響を及ぼす等の問題がある 。このようなシール材の固着を防ぐために、シール材の表面に非粘着性を付与することが 要求される。非粘着性を付与する方法としては、固体潤滑剤などのフィラーを添加する方 法があるが、成形品のスキン層を取り除かなければ、効果が出ないため用途が限定される ことや、軟質材料の強度、硬度、シール性といった特性に与える影響も大きい。

[0003]

また、半導体製造工程においては、絶縁膜や金属配線薄膜形成工程に使用されるCVD 装置中の、種々の連結部分や可動部分に封止のためにシール材が使用されている。これら のシール材には、シール性、非固着性だけではなく、プロセスの微細化や基板ウェハーの 大型化により、高密度($10^{12}\sim10^{13}$ / cm^3)のプラズマ処理条件に耐えられること 、および極めて精密な加工が要求される半導体を汚染しないことが要求される。このよう な要求に対応できるシール材としては、主に架橋性のフッ素系エラストマーおよびシリコ ーン系エラストマーが採用されており、さらに、これらのエラストマーに耐プラズマ性を 付与する方法として、プラズマ遮蔽効果のあるフィラーをエラストマーに充填する方法が 一般的に知られている(例えば、特許文献1参照)。

[0004]

しかし、これらのフィラーが充填されたエラストマー材料においても、プラズマに暴露 されることにより、徐々にエラストマーが劣化し、充填されていた耐プラズマ性を付与す るフィラーが脱落してしまう。該フィラーが脱落することでパーティクルの発生につなが る他、エラストマー材料の耐プラズマ性が低下するため、長期的にみれば、充分なもので はない。また、耐(酸素)プラズマ性および固着性の改良の目的で、架橋可能な含フッ素 エラストマーを含む組成物からなる基材の表面の少なくとも一部に、ダイヤモンドライク カーボンを設けてなるシール材が開示されており(例えば、特許文献2参照)、さらに、 固着性の改良、すべり性付与の目的でゴム基材の表面にダイヤモンドライクカーボンを設 けてなるシール材 (例えば、特許文献3、4または5参照) が開示されている。しかし、 これらの方法では、耐プラズマ性、特に酸素系のプラズマに対する耐性が低い。

従って、ゴム基材の持つ強度、硬度、シール性を保ちつつ、表面が非粘着性であり、か つ耐薬品性、耐プラズマ性を有するシール材はいまだ知られていない。

[0006]

【特許文献1】国際公開第03/051999号パンフレット

【特許文献2】特開2003-165970号公報

【特許文献3】特開2002-47479号公報

【特許文献4】特開2002-47480号公報

【特許文献5】特開2002-48240号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

本発明は、表面コーティングされたシール材に関し、軟質基材の持つ強度、硬度、シー

ル性を保ちつつ、非粘着性、耐薬品性、耐プラズマ性を高めたシール材を提供する。 【課題を解決するための手段】

[0008]

すなわち本発明は、ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が40~100 である軟質材料からなる基材の表面全体または一部に、金属、金属酸化物、金属チッ化物 、金属炭化物およびそれらの複合物からなる群より選ばれる1種以上の金属または金属化 合物からなるコーティング膜を有するシール材に関する。

[0009]

軟質材料が、エラストマーであることが好ましい。

[0010]

軟質材料が、フッ素系高分子材料であることが好ましい。

[0011]

軟質材料が、フッ素ゴムであることが好ましい。

[0012]

コーティング膜の膜厚が、 0. 005~1μmであることが好ましい。

[0013]

JIS K5600の碁盤目テープ試験(1mm角/100目)にて測定される軟質材 料とコーティング膜との剥離数が50/100以下となる密着度で、軟質材料とコーティ ング膜が密着していることが好ましい。

[0014]

下記条件で O_2 、 CF_4 、 NF_3 のそれぞれのプラズマを照射した時の重量減少率が、全 て1重量%以下であることが好ましい。

[0015]

. 記

サンプル:厚さ2mm、10mm×35mmのシート

照射条件:

ガス流量・・・・・・16SCCM O_2 , CF_4 \mathcal{T} \mathcal{T} \mathcal{T}

圧力······20mTorr

出力 800W

照射時間・・・・・・30分

NF₃/Ar······1SLM/1SLM NF3プラズマ

圧力······3 Torr

照射時間・・・・・・2時間

温度・・・・・・150℃

コーティング膜が、真空成膜法により成膜されることが好ましい。

[0016]

真空成膜法が、イオンプレーティング法であることが好ましい。

[0017]

また、本発明は、前記シール材を有する液晶・半導体製造装置に関する。

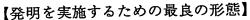
[0018]

さらに、本発明は、ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が40~100 である軟質材料からなる基材の表面全体または一部を、イオンプレーティング法により、 金属、金属酸化物、金属チッ化物、金属炭化物およびそれらの複合物からなる群より選ば れる1種以上の金属または金属化合物でコーティングする工程を有するシール材の製造方 法に関する。

【発明の効果】

[0019]

本発明のシール材は、表面に非常に薄いコーティング層を有するため、軟質基材の持つ 強度、硬度、シール性を保ちつつ、耐薬品性、耐プラズマ性、非粘着性を高めたシール材 を提供することが可能となる。



[0020]

本発明は、ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が40~100である軟 質材料からなる基材の表面全体または一部に、金属、金属酸化物、金属チッ化物、金属炭 化物およびその複合物からなる群より選ばれる1種以上の金属または金属化合物からなる コーティング膜を有するシール材に関する。

[0021]

本発明で使用される軟質材料は、ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が 40~100である。ショアD硬度は、65以下であることが好ましく、ショアA硬度は 、50~100であることが好ましい。ショアD硬度が、75を超えると、軟質材料とは 言い難く、硬すぎてシール材としては不適であり、ショアA硬度が40未満であると、柔 らかすぎて、適正なシール力が得られにくい傾向がある。軟質材料としては、ショアD硬 度が75以下であり、かつショアA硬度が40~100のものであれば、特に限定はされ ないが、たとえば、フッ素樹脂やフッ素ゴムなどのフッ素系高分子材料、フロロシリコン ゴム、シリコンゴム、NBR、EPDMなどがあげられ、これらの中でも、フッ素系高分 子材料が好ましく、フッ素ゴムがより好ましい。

[0022]

フッ素ゴムとしては、従来からシール材用、とくに半導体製造装置のシール材に用いら れているものであれば、とくに制限はなく、例えば、フッ素ゴム(a)、熱可塑性フッ素 ゴム(b)、およびこれらのフッ素ゴムからなるゴム組成物などがあげられる。

[0023]

フッ素ゴム (a) としては、非パーフルオロフッ素ゴム (a-1) およびパーフルオロ フッ素ゴム (a-2) があげられる。

[0024]

熱可塑性フッ素ゴム(b)としては、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと 非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントからなり、エラストマー性含フッ素ポリ マー鎖セグメントおよび非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントのそれぞれの構 成単位の90モル%以上がパーハロオレフィンである含フッ素多元セグメント化ポリマー (b-1)、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと非エラストマー性含フッ素 ポリマー鎖セグメントからなり、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの構成単 位の90モル%以上がパーハロオレフィンであり、かつ非エラストマー性含フッ素ポリマ ー鎖セグメントが構成単位として90モル%未満のパーハロオレフィンを含む含フッ素多 元セグメント化ポリマー(b-2)、およびエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメン トと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントからなり、エラストマー性含フッ素 ポリマー鎖セグメントが構成単位として90モル%未満のパーハロオレフィンを含み、か つ非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの構成単位の90モル%以上がパーハ ロオレフィンであるかまたは構成単位として90モル%未満のパーハロオレフィンを含む 含フッ素多元セグメント化ポリマー(b-3)があげられる。

[0025]

非パーフルオロフッ素ゴム (a-1) としては、ビニリデンフルオライド (VdF) 系 フッ素ゴム、テトラフルオロエチレン(TFE)/プロピレン系フッ素ゴム、テトラフル オロエチレン(TFE)/プロピレン/ビニリデンフルオライド(VdF)系フッ素ゴム 、エチレン/ヘキサフルオロプロピレン(HFP)系フッ素ゴム、エチレン/ヘキサフル オロプロピレン (HFP) /ビニリデンフルオライド (VdF) 系フッ素ゴム、エチレン **/ヘキサフルオロプロピレン(HFP)/テトラフルオロエチレン(TFE)系フッ素ゴ** ム、フルオロシリコーン系フッ素ゴム、またはフルオロホスファゼン系フッ素ゴムなどが あげられ、これらをそれぞれ単独で、または本発明の効果を損なわない範囲で任意に組合 わせて用いることができる。

[0026]

ビニリデンフルオライド系フッ素ゴムとは、ビニリデンフルオライド45~85モル%

と、ビニリデンフルオライドと共重合可能な少なくとも1種の他の単量体55~15モル %とからなる含フッ素エラストマー性共重合体をいう。好ましくは、ビニリデンフルオラ イド50~80モル%と、ビニリデンフルオライドと共重合可能な少なくとも1種の他の 単量体50~20モル%とからなる含フッ素エラストマー性共重合体をいう。

[0027]

ビニリデンフルオライドと共重合可能な少なくとも1種の他の単量体としては、たとえ ばテトラフルオロエチレン (TFE)、クロロトリフルオロエチレン (CTFE)、トリ **フルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン(HFP)、トリフルオロプロピレン、テ** トラフルオロプロピレン、ペンタフルオロプロピレン、トリフルオロブテン、テトラフル オロイソブテン、パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)(PAVE)、フッ化ビニル などの含フッ素単量体、エチレン、プロピレン、アルキルビニルエーテルなどの非フッ素 単量体があげられる。これらをそれぞれ単独で、または、任意に組み合わせて用いること ができる。これらのなかでも、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パ ーフルオロ (アルキルビニルエーテル) が好ましい。

[0028]

具体的なゴムとしては、VdF-HFP系ゴム、VdF-HFP-TFE系ゴム、Vd F-CTFE系ゴム、VdF-CTFE-TFE系ゴムなどがある。

[0029]

テトラフルオロエチレン/プロピレン系フッ素ゴムとは、テトラフルオロエチレン45 ~70モル%、プロピレン55~30モル%からなり、さらにテトラフルオロエチレンと プロピレンの合計量に対して、架橋部位を与える単量体0~5モル%含有する含フッ素共 重合体をいう。

[0030]

架橋部位を与える単量体としては、たとえば特公平5-63482号公報、特開平7-316234号公報に記載されているようなパーフルオロ(6,6ージヒドロー6ーヨー ドー3-オキサー1-ヘキセン) やパーフルオロ (5-ヨードー3-オキサー1ーペンテ ン)などのヨウ素含有単量体、特開平4-505341号公報に記載されている臭素含有 単量体、特開平4-505345号公報、特開平5-500070号公報に記載されてい るようなニトリル基含有単量体、カルボキシル基含有単量体、アルコキシカルボニル基含 有単量体などがあげられる。

[0031]

これらの非パーフルオロフッ素ゴム (a-1) は、常法により製造することができる。

[0032]

パーフルオロフッ素ゴム(a-2)としては、テトラフルオロエチレン/パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) /架橋部位を与える単量体からなるものなどがあげられる。 テトラフルオロエチレン/パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) の組成は、50~9 $0/10\sim50$ モル%であることが好ましく、より好ましくは、 $50\sim80/20\sim50$ モル%であり、さらに好ましくは、55~70/30~45モル%である。また、架橋部 位を与える単量体は、テトラフルオロエチレンとパーフルオロ(アルキルビニルエーテル) の合計量に対して、 $0\sim5$ モル%であることが好ましく、 $0\sim2$ モル%であることがよ り好ましい。

[0033]

この場合のパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)としては、たとえばパーフルオロ (メチルビニルエーテル)、パーフルオロ (プロピルビニルエーテル) などがあげられ、 これらをそれぞれ単独で、または任意に組合わせて用いることができる。

[0034]

架橋部位を与える単量体としては、たとえば、一般式(1):

(1) $C X_{2}^{1} = C X_{1}^{1} - R_{1}^{1} C H R_{1}^{1} X_{2}^{2}$

(式中、 X^1 は、H、Fまたは CH_3 、 R^1_f は、フルオロアルキレン基、パーフルオロアル キレン基、フルオロポリオキシアルキレン基またはパーフルオロポリオキシアルキレン基

、 R^1 は、Hまたは $C\,H_3$ 、 X^2 は、ヨウ素または臭素)で表されるヨウ素または臭素含有 単量体、一般式(2):

 $CF_2 = CFO (CF_2CF (CF_3) O)_m (CF_2)_n - X^3$

(式中、mは、 $0\sim5$ の整数、nは、 $1\sim3$ の整数、 X^3 は、ニトリル基、カルボキシル 基、アルコキシカルボニル基、臭素基)で表される単量体などがあげられ、これらをそれ ぞれ単独で、または任意に組合わせて用いることができる。

[0035]

このヨウ素、ニトリル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、臭素基が、架橋 点として機能することができる。

[0036]

パーフルオロフッ素ゴム(a-2)は、常法により製造することができる。

[0037]

かかるパーフルオロフッ素ゴム (a-2) の具体例としては、国際公開 9 7 / 2 4 3 8 1パンフレット、特公昭61-57324号公報、特公平4-81608号公報、特公平 5-13961号公報などに記載されているフッ素ゴムなどがあげられる。

[0038]

つぎに、熱可塑性フッ素ゴム (b) である、含フッ素多元セグメント化ポリマー (b-1) について説明する。

[0039]

まず、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントについて説明する。エラストマー 性含フッ素ポリマー鎖セグメントは、重合体に柔軟性を付与し、ガラス転移点が25℃以 下、好ましくは0℃以下である。その構成単位の90モル%以上を構成するパーハロオレ フィンとしては、たとえば、テトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、ヘ キサフルオロプロピレン、一般式(3):

 $CF_2 = CFO (CF_2CFYO)_p - (CF_2CF_2CF_2O)_q - R_f^2$ (式中、Yは、FまたはCF₃、 R_f^2 は、炭素数 $1\sim 5$ のパーフルオロアルキル基、pは 、 $0\sim5$ の整数、 \mathbf{q} は、 $0\sim5$ の整数)で表されるパーフルオロビニルエーテルなどがあ げられる。

[0040]

エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを構成するパーハロオレフィン以外の構 成単位としては、たとえばビニリデンフルオライド、トリフルオロエチレン、トリフルオ ロプロピレン、テトラフルオロプロピレン、ペンタフルオロプロピレン、トリフルオロブ テン、テトラフルオロイソプテン、フッ化ビニルなどの含フッ素単量体、エチレン、プロ ピレン、アルキルビニルエーテルなどの非フッ素単量体などであればよい。

[0041]

エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの好ましい例としては、テトラフルオロ エチレン/パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) /架橋部位を与える単量体からなる エラストマー性ポリマー鎖があげられる。テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アル キルビニルエーテル)の組成は、50~85/50~15モル%であり、架橋部位を与え る単量体が、テトラフルオロエチレンとパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)の合計 量に対して、0~5モル%であることが好ましい。

[0042]

架橋部位を与える単量体としては、たとえば、一般式(1)、一般式(2)で表される ような単量体などがあげられる。

[0043]

つぎに、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントについて説明する。非エラス トマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの構成単位の90モル%以上を構成するパーハロ オレフィンとしては、たとえばテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、 パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)、ヘキサフルオロプロピレン、一般式(4): (4) $CF_2 = CF (CF_2) r X^4$

(式中、rは、 $1\sim10$ の整数、 X^4 は、FまたはC1) で表される化合物、パーフルオ ロー2ーブテンなどのパーハロオレフィンなどがあげられる。

[0044]

非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを構成するパーハロオレフィン以外の 構成単位としては、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントを構成するパーハロオ レフィン以外の構成単位と同様のものがあげられる。

[0045]

非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの好ましい例としては、テトラフルオ ロエチレン85~100モル%、および一般式(5):

$$CF_2 = CF - R_f^3$$
 (5)

(式中、 R_f^3 は、 R_f^4 または $-OR_f^4$ であり、 R_f^4 は、炭素数 $1\sim 5$ のパーフルオロアル キル基)で表される化合物0~15モル%からなる非エラストマー性ポリマー鎖があげら れる。

[0046]

つぎに、含フッ素多元セグメント化ポリマー(b-2)について説明する。

[0047]

この場合のエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントは、前記含フッ素多元セグメ ント化ポリマー (b-1) について説明したものと同じでよい。

[0048]

非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの構成単位としては、ビニリデンフル オライド、フッ化ビニル、トリフルオロエチレン、一般式(6):

$$CH_2 = CX^5 - (CF_2) - X^5$$
(6)

(式中、 X^5 は、HまたはF、sは、 $1\sim 10$ の整数)で表される化合物、 $CH_2=C$ (CF₃) 2などの部分フッ素化オレフィンなどがあげられる。

[0049]

また、これらの単量体と共重合可能なエチレン、プロピレン、塩化ビニル、ビニルエー テル、カルボン酸ビニルエステル、アクリル酸などの単量体も共重合成分として用いるこ とができる。

[0050]

つぎに、含フッ素多元セグメント化ポリマー(b-3)について説明する。

[0051]

含フッ素多元セグメント化ポリマー (b-3) におけるエラストマー性含フッ素ポリマ ー鎖セグメントはガラス転移点が25℃以下、好ましくは0℃以下のポリマー鎖である。

[0052]

また、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントは、構成単位として90モル%未 満のパーハロオレフィンを含む。この場合のパーハロオレフィン以外の構成単位としては 、前記含フッ素多元セグメント化ポリマー(b-1)のパーハロオレフィン以外の構成単 位と同じものがあげられる。

[0053]

含フッ素多元セグメント化ポリマー(b-3)における非エラストマー性含フッ素ポリ マー鎖セグメントは、前述した含フッ素多元セグメント化ポリマー(b-1)または(b - 2) における非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントと同じでよい。

[0054]

熱可塑性フッ素ゴム(b)は、1分子中にエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメン トと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントがブロックやグラフトの形態で結合 した含フッ素多元セグメント化ポリマーであることが重要である。

[0055]

そこで、熱可塑性フッ素ゴム(b)の製造方法としては、公知の種々の方法が採用でき るが、なかでも特公昭58-4728号公報などに示されたブロック型の含フッ素多元セ グメント化ポリマーの製法や、特開昭62-34324号公報に示されたグラフト型の含 フッ素多元セグメント化ポリマーの製法などが好ましく採用できる。

[0056]

とりわけ、セグメント化率(ブロック化率)も高く、均質で規則的なセグメント化ポリ マーが得られることから、特公昭58-4728号公報、高分子論文集(Vol.49、 No. 10、1992) 記載のいわゆるヨウ素移動重合法で合成されたブロック型の含フ ッ素多元セグメント化ポリマーが好ましい。

[0057]

エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントは、フッ素ゴムの製造法として公知のヨ ウ素移動重合法で製造できる。たとえば、実質的に無酸素下で、水媒体中で、ヨウ素化合 物、好ましくはジヨウ素化合物の存在下に、前記パーハロオレフィンと、要すれば硬化部 位を与える単量体を加圧下で撹拌しながらラジカル開始剤の存在下、乳化重合を行なう方 法があげられる。使用するジョウ素化合物の代表例としては、たとえば、1,3-ジョー ドパーフルオロプロパン、1, 4 - ジョードパーフルオロブタン、1, 3 - ジョードー2 ークロロパーフルオロプロパン、1,5-ジョード-2,4-ジクロロパーフルオロペン タン、1,6-ジョードパーフルオロヘキサン、1,8-ジョードパーフルオロオクタン 、1,12-ジヨードパーフルオロドデカンおよび1,16-ジヨードパーフルオロヘキ サデカン、ジョードメタン、1,2-ジョードエタンがあげられる。これらの化合物は、 単独で使用してもよく、相互に組み合せて使用することもできる。なかでも、1,4-ジ ヨードパーフルオロブタンが好ましい。ジョウ素化合物の添加量は、エラストマー性含フ ッ素ポリマー鎖セグメント全重量に対して、0.01~1重量%であることが好ましい。

[0058]

このようにして得られるエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの末端部分はパ ーハロ型となっており、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントのプロック共重 合の開始点となるヨウ素原子を有している。

[0059]

本発明におけるエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの製造で使用するラジカ ル重合開始剤は、従来からフッ素系エラストマーの重合に使用されているものと同じもの でよい。これらの開始剤には有機および無機の過酸化物ならびにアゾ化合物がある。典型 的な開始剤として過硫酸塩類、過酸化カーボネート類、過酸化エステル類などがあり、好 ましい開始剤として過硫酸アンモニウム(APS)があげられる。APSは単独で使用し てもよく、またサルファイト類、亜硫酸塩類のような還元剤と組み合わせて使用すること もできる。

[0060]

こうして得られるエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの数平均分子量は、得 られる含フッ素多元セグメント化ポリマー全体へ柔軟性の付与、弾性の付与、機械的物性 00,000であることがより好ましい。

[0061]

ついで、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントのエラストマー性含フッ素ポ リマー鎖セグメントへのプロック共重合は、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメン トの乳化重合に引き続き、単量体を非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメント用に 変えることにより行なうことができる。

[0062]

得られる非エラストマー性セグメントの数平均分子量は、1,000~1,200,0 00が好ましく、より好ましくは3,000~600,000である。

[0063]

こうして得られる熱可塑性フッ素ゴム(b)は、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セ グメントの両側に非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントが結合したポリマー分 子、エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの片側に非エラストマー性含フッ素ポ リマー鎖セグメントが結合したポリマー分子を主体とするものである。

[0064]

また、得られる熱可塑性フッ素ゴム(b)(含フッ素多元セグメント化ポリマー)の耐 熱性という点から、非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントの結晶融点は、15 0℃以上であることが好ましく、200~360℃であることがより好ましい。

[0065]

本発明においては、前述のようなフッ素ゴム(a)と熱可塑性フッ素ゴム(b)とから なる組成物を用いることもできる。

[0066]

本発明に使用される架橋剤としては、採用する架橋系によって適宜選定すればよい。架 橋系としてはポリアミン架橋系、ポリオール架橋系、パーオキサイド架橋系、イミダゾー ル架橋系のいずれも採用できる。また、トリアジン架橋系、オキサゾール架橋系、チアゾ ール架橋系なども採用できる。

[0067]

架橋剤としては、ポリオール架橋系では、たとえば、ビスフェノールAF、ヒドロキノ ン、ビスフェノールA、ジアミノビスフェノールAFなどのポリヒドロキシ化合物が、パ ーオキサイド架橋系では、たとえば、α, α $^{\prime}$ -ビス(t -ブチルパーオキシ)ジイソプ ロピルベンゼン、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキサン、ジ クミルパーオキサイドなどの有機過酸化物が、ポリアミン架橋系では、たとえばヘキサメ チレンジアミンカーバメート、N, N' ージシンナミリデンー1, 6 ーヘキサメチレンジ アミンなどのポリアミン化合物があげられる。

[0068]

オキサゾール架橋系、イミダゾール架橋系、チアゾール架橋系に使用する架橋剤として は、たとえば一般式(7):

[0069]

【化1】

$$R^{4} \longrightarrow R^{2} \longrightarrow R^{4}$$
 (7)

[0070]

(式中、 R^2 は、 $-SO_2$ -、-O-、-CO-、炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基、炭素数1 $\sim 1~0$ のパーフルオロアルキレン基または単結合手であり、 R^3 および R^4 は、一方が-N H_2 であり他方が $-NH_2$ 、-OHまたは-SH、好ましくは R^3 および R^4 のいずれも-NH2である)で示されるビスジアミノフェニル系架橋剤、ビスアミノフェノール系架橋剤 、ビスアミノチオフェノール系架橋剤、一般式(8):

[0071]

【化2】

$$R^5 \longrightarrow R^2 \longrightarrow R^5$$
 (8)

(式中、R²は前記と同じ、R⁵は - C

$$\texttt{sch} - C \left(\frac{\text{NOH}}{\text{NH}_2} \right)$$

で示されるビスアミドラゾン系架橋剤、一般式 (9) または一般式 (10): 【0073】 【化3】

$$\begin{array}{ccc}
NH & NH \\
\parallel & \parallel \\
H_2NHN-C-R_f^5-C-NHNH_2
\end{array} (9)$$

【0074】 (式中、 R_f^5 は、炭素数 $1\sim10$ のパーフルオロアルキレン基)、 【0075】 【化4】

$$\begin{array}{ccc}
NH_2 & NH_2 \\
| & | \\
HON=C + CF_2 + C=NOH
\end{array} (10)$$

[0076]

(式中、nは、1~10の整数)で示されるビスアミドキシム系架橋剤などがあげられる。これらのビスアミノフェノール系架橋剤、ビスアミノチオフェノール系架橋剤またはビスジアミノフェニル系架橋剤などは従来ニトリル基を架橋点とする架橋系に使用していたものであるが、前記フッ素ゴムが有するカルボキシル基およびアルコキシカルボニル基とも反応し、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール環を形成し、架橋物を与える。

[0077]

特に好ましい架橋剤としては複数個の3ーアミノー4ーヒドロキシフェニル基を有する 化合物、3ーアミノー4ーメルカプトフェニル基を有する化合物、または一般式(11)

【0078】 【化5】

$$H_2N$$
 R^2
 NH_2
 NH_2
 (11)

[0079]

(式中、 R^2 は前記と同じ)で示される 3, 4 ージアミノフェニル基を有する化合物があげられ、具体的には、たとえば 2, 2 ービス(3 ーアミノー4 ーヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン(一般名:ビス(アミノフェノール) AF)、 2, 2 ービス(3 ーアミノー4 ーメルカプトフェニル)へキサフルオロプロパン、テトラアミノベンゼン、ビスー 3, 4 ージアミノフェニルメタン、ビスー 3, 4 ージアミノフェニルエーテル、 2, 2 ービス(3, 4 ージアミノフェニル)へキサフルオロプロパンなどである。

[080]

イミダゾール架橋系の架橋剤としては、一般式(11)に示される化合物などがあるが、耐熱性の点で、イミダゾール環上に置換基を有するものが好ましく、具体的には、2, 2-ビス-[3-アミノ-4-(N-メチルアミノ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、<math>2, 2-ビス-[3-アミノ-4-(N-エチルアミノ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、<math>2, 2-ビス-[3-アミノ-4-(N-プロピルアミノ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、<math>2, 2-ビス-[3-アミノ-4-(N-フェニルアミノ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、<math>2, 2-ビス-[3-アミノ-4-(N-フェニルアミノ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、<math>2, 2-ビス-[3-アミノ-4-(N-パーフルオロフェニ

ルアミノ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス-[3-アミノ-4-(N ーベンジルアミノ)フェニル] ヘキサフルオロプロパンなどがあげられる。しかし、これ らに限られるものではない。

[0081]

架橋剤の添加量は、エラストマー100重量部に対して、0.01~10重量部である ことが好ましく、より好ましくは0.1~5重量部である。架橋剤が、0.01重量部よ り少ないと、架橋度が不足するため、含フッ素成形品の性能が損なわれる傾向があり、1 0 重量部をこえると、架橋密度が高くなりすぎるため架橋時間が長くなる傾向があること に加え、経済的にも好ましくない。

[0082]

ポリオール架橋系の架橋助剤としては、各種の4級アンモニウム塩、4級ホスホニウム 塩、環状アミン、1官能性アミン化合物など、通常エラストマーの架橋に使用される有機 塩基が使用できる。具体例としては、たとえば、テトラブチルアンモニウムブロミド、テ トラブチルアンモニウムクロリド、ベンジルトリブチルアンモニウムクロリド、ベンジル トリエチルアンモニウムクロリド、テトラプチルアンモニウム硫酸水素塩、テトラブチル アンモニウムヒドロキシドなどの4級アンモニウム塩;ベンジルトリフェニルホスホニウ ムクロライド、トリプチルアリルホスホニウムクロリド、トリブチルー2-メトキシプロ ピルホスホニウムクロリド、ベンジルフェニル(ジメチルアミノ)ホスホニウムクロリド などの4級ホスホニウム塩;ベンジルメチルアミン、ベンジルエタノールアミンなどの一 官能性アミン;1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ーウンデクー7-エンなどの環状 アミンなどがあげられる。

[0083]

パーオキサイド架橋系の架橋助剤としては、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソ シアヌレート (TAIC) 、トリス (ジアリルアミン-s-トリアジン) 、トリアリルホ スファイト、N, Nージアリルアクリルアミド、ヘキサアリルホスホルアミド、N, N, N' , N' - \mathcal{F} F F アミド、トリビニルイソシアヌレート、2,4,6-トリビニルメチルトリシロキサン、ト リ (5-ノルボルネン-2-メチレン) シアヌレートなどがあげられる。これらの中でも 、架橋性、架橋物の物性の点から、トリアリルイソシアヌレート(TAIC)が好ましい

[0084]

架橋助剤の添加量は、エラストマー100重量部に対して、0.01~10重量部であ り、好ましくは0.1~5重量部である。架橋助剤が、0.01重量部より少ないと、架 橋時間が実用に耐えないほど長くなる傾向があり、10重量部をこえると、架橋時間が速 くなり過ぎることに加え、成形品の圧縮永久歪も低下する傾向がある。

[0085]

さらに、強度、硬度、シール性の点から、カーボンプラック、金属酸化物などの無機フ ィラー、エンジニアリング樹脂粉末などの有機フィラーなどの充填材を添加することが好 ましい。具体的には、金属酸化物としては、酸化アルミニウム、酸化マグネシウムなどが あげられ、有機フィラーとしては、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド などのイミド構造を有するイミド系フィラー;ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエー テルスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリオキシベ ンゾエートなどをあげることができるが、これらの中でも、耐熱性、耐プラズマ性の点か ら、酸化アルミニウム、ポリイミドを添加することが好ましい。

[0086]

これらの充填材の添加量は、架橋性エラストマー100重量部に対して、1~50重量 部であることが好ましく、5~20重量部であることがより好ましい。充填材の添加量が 、1重量部未満であると、ほとんど充填材としての効果が期待できない傾向があり、50 重量部をこえると、非常に高硬度となり、シール材として適さない傾向にある。

[0087]

また、加工助剤、顔料、水酸化カルシウムのような金属水酸化物などを本発明の目的を 損なわない限り使用してもよい。

[0088]

本発明のシール材は、ショアD硬度が75以下であり、かつショアA硬度が40~10 0 である軟質材料からなる基材の表面全体または一部を金属、金属酸化物、金属窒化物、 金属炭化物、およびそれらの複合物からなる群より選ばれる1つ以上の金属または金属化 合物でコーティングすることにより得られる。

[0089]

金属としては、アルミニウム、シリコン、チタン、イットリウムなどがあげられ、それ ぞれの酸化物、窒化物、炭化物があげられる。これらの中でも、材料価格、取り扱い性、 耐プラズマ性の点から、アルミニウム、アルミナが好ましい。

[0090]

金属または金属化合物からなるコーティング膜の厚さは、0.005~1 μ mであるこ とが好ましく、 $0.05\sim0.5\mu$ mであることがより好ましい。コーティング膜の厚 さが、0.005μm未満であると、非固着性、耐プラズマ性といった特性が充分でない 傾向があり、1μmをこえると、シール材の変形に追従できないため、表面に耐プラズマ 性を悪化させるような亀裂を生じる傾向がある。

[0091]

金属または金属化合物からなるコーティング膜の成膜方法としては、真空成膜法が使用 される。真空成膜法としては、イオンプレーティング法、スパッタ法、CVD法、蒸着法 などがあげられるが、これらの中でも、コーティング膜の密着性の点、低温での加工が可 能である点、コーティング用の蒸発材料の入手が容易な点、窒化物・炭化物の加工も可能 であるといった点から、イオンプレーティング法が好ましく、その中でも、ホローカソー ドプラズマガンを使用するイオンプレーティング法がより好ましい。

[0092]

イオンプレーティング法による成膜条件としては、軟質基材の種類、膜種、および目的 の膜厚により適宜設定すればよいが、成膜速度としては、0.1~5 nm/秒が好ましく 、0.3~2 nm/秒がより好ましい。成膜速度が、0.1 nm/秒未満であると、目的 の膜厚を得るのに多大な時間を要する傾向にあり、5nm/秒をこえると、コーティング 面が荒れやすく、膜厚の制御が困難となる傾向にある。

[0093]

また、コーティングする前に、基材表面をプラズマアッシングなどにより表面処理する ことが、コーティング層の密着性を高める上で好ましい。

[0094]

さらに、金属または金属化合物からなるコーティング膜を複数層にすることもできる。 例えば、第一層として、アルミニウム、第二層として、金の2層からなるコーティング膜 などをあげることができる。このように複数層にすることで、直接、軟質基材に密着させ ることが困難であった金属または金属化合物によるコーティングや非常に高価であるコー ティング材料の使用量を最小限におさえることができる。

[0095]

本発明のシール材の軟質材料と金属または金属化合物からなるコーティング膜は、JI K 5 6 0 0 の碁盤目テープ試験(1 mm角/1 0 0 目)にて測定される軟質材料とコ ーティング膜との剥離数が50/100以下となる密着度で密着していることが好ましく 、5/100以下であることがより好ましい。剥離数が、50/100をこえると、軽い 摩擦によってもコーティング膜が剥離する傾向がある。また、碁盤目テープ試験に用いら れるテストピースは、シール材に使用される軟質材料およびコーティング膜からなるシー ト(厚さ2mm、15mm×15mm)に所望の厚さのコーティング膜を施したものであ る。

[0096]

本発明のシール材は、下記条件下で、 O_2 、 CF_4 、 NF_3 プラズマをそれぞれ照射した

時の重量減少率が、全て1重量%以下であることが好ましく、0.1重量%以下であるこ とがより好ましい。重量減少率が、1重量%を超えると、コーティング膜によるプラズマ の遮蔽効果がほとんど無い傾向がある。

[0097]

記

サンプル:厚さ2mm、10mm×35mmのシート

照射条件:

ガス流量・・・・・・16 S C C M O2、CF4プラズマ

圧力······20mTorr

出力・・・・・・・800W 照射時間・・・・・・30分

 $NF_3/Ar \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1SLM/1SLM$ NF3プラズマ

圧力・・・・・・・3 Torr 照射時間・・・・・・2時間 温度・・・・・・150℃

[0098]

本発明の、軟質基材の持つ強度、硬度、シール性を保ちつつ、非粘着性、耐薬品性、耐 プラズマ性を有するシール材は、液晶・半導体製造装置に好適に用いることができる。

【実施例】

[0099]

つぎに本発明を実施例をあげて説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるも のではない。

[0100]

評価法

<クラック性>

成膜された基板を180度折り曲げて、表面にクラックや剥離が発生するかを目視によ り観察し、下記基準により評価する。

- ○:クラック、剥離の発生がない。
- ×:明らかなクラック、剥離がある。

[0101]

<表面粗さ(Ra)>

表面粗さ計(機種名:表面形状測定顕微鏡VF-7500、(株)キーエンス製)を用 いて測定する。

[0102]

<密着性-1>

厚さ2mm、15mm×15mmのシートを用いて、JIS K5600の碁盤目テー プ試験(1mm角/100目)に準拠して、密着性を測定する。

[0103]

<密着性-2>

ペンコットM5 (旭化成工業 (株) 製) を用いて、厚さ2mm、10mm×20mmの シートのコーティング面を20回擦り、表面の剥離の状態を下記基準により評価する。

- 〇:20回擦り後において剥離がなかった。
- △:10~20回の擦りで剥離した。
- ×:10回未満の擦りで剥離した。

[0104]

<耐プラズマ性>

厚さ2mm、10mm×35mmのシート片を用いて、以下の条件で耐プラズマ性を測 定する。ただし、コーティング膜で覆われていないシート側面がプラズマ照射による影響 を受けないように、四フッ化エチレン樹脂製のシート(厚さ2mm、45mm×20mm) の中央部分をくり貫いて(10mm×35mm)作製した保護枠に、コーティング面を 上にしてシートをはめ込み、プラズマ照射を行う。

[0105]

(O₂、CF₄プラズマ)

使用プラズマ照射装置:ICP高密度プラズマ装置((株)サムコインターナショナル研

究所製、MODEL RIE-101iPH)

ガス流量・・・・・・168CCM 照射条件:

圧力······20mTorr 出力 · · · · · · · 800W 照射時間・・・・・・30分

[0106]

(NF3プラズマ)

使用プラズマ照射装置:アストロンフッ素原子ジェネレーターAX7657-2

(アステックス (ASTEX) 社製)

 $NF_3/Ar \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1SLM/1SLM$ 照射条件:

圧力・・・・・・・3 Torr 照射時間・・・・・・・2 時間 温度・・・・・・150℃

照射操作:プラズマ照射装置のチャンバー内の雰囲気を安定させるために、チャンバー前 処理として5分間かけて実ガス空放電を行なう。ついで被験サンプルを入れたアルミニウ ム製の容器をRF電極の中心部に配置し、上記の条件下でプラズマを照射する。

重量測定:ザートリウス(Sertorious)・GMBH製の電子分析天秤2006 MPE(商品名)を使用し、0.01mgまで測定し0.01mgの桁を四捨五入する。 表面粗度測定:表面粗さ計(機種名:表面形状測定顕微鏡VF-7500、(株)キーエ ンス製)を用いて測定する。

[0107]

(ショア A 硬度)

ASTM D2240に準拠して、測定を行う。具体的には、高分子計器株式会社製ア ナログ硬さ計のA型を用いて測定を行う。

[0108]

(ショアD硬度)

ASTM D2240に準拠して、測定を行う。具体的には、高分子計器株式会社製ア ナログ硬さ計のD型を用いて測定を行う。

[0109]

参考例1

(フッ素ゴムシート(A)の作製)

含フッ素エラストマー(ダイエルパーフロGA-105、ダイキン工業(株)製)と、 パーヘキサ25B(日本油脂(株)製)とトリアリルイソシアヌレート(TAIC)(日 本化成(株)製)と酸化アルミニウムとを重量比100/1/2/15で、オープンロー ルにて混練して架橋可能なフッ素系エラストマー組成物を得た。

[0110]

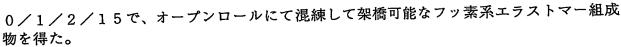
得られたフッ素系エラストマー組成物を、160℃で、7分間プレスして架橋を行なっ たのち、さらに、180℃のエアーオーブン中で4時間かけてオーブン架橋し、厚さが2 mmである100mm×75mmのフッ素ゴムシート(A)を得た。フッ素ゴムシート(A) の表面粗さ (Ra) は、0.18 µ mであった。

[0111]

参考例 2

(フッ素ゴムシート(B)の作製)

含フッ素エラストマー(ダイエルパーフロGA-105、ダイキン工業(株)製)と、 パーヘキサ25B(日本油脂(株)製)とトリアリルイソシアヌレート(TAIC)(日 本化成(株)製)とポリイミド樹脂粉末UIP-S (宇部興産(株)製)とを重量比10



[0112]

得られたフッ素系エラストマー組成物を、160℃で、7分間プレスして架橋を行なっ たのち、さらに、180℃のエアーオーブン中で4時間かけてオープン架橋し、厚さが2 mmである100mm×75mmのフッ素ゴムシート(B)を得た。フッ素ゴムシート(B) の表面粗さ(Ra)は、0.21 μ mであった。

[0113]

実施例1

参考例 1 で得られたフッ素ゴムシート (A) を、アルカリ超音波洗浄 (4 5 ℃) 1. 5 分、一般水道水超音波洗浄1.5分、一般水道水バプリング洗浄1.5分、純水超音波洗 浄3分、純水バブリング洗浄1.5分、温純水洗浄 数分の順番で洗浄をした。洗浄後の フッ素ゴムシートを基材とし、その表面にイオンプレーティング装置(成膜条件:蒸発材 料 Al、放電電流 50A、Ar流量 40SCCM、成膜圧力 0.25mTorr) を用いて、厚さ $0.2 \mu m$ のアルミニウムのコーティング膜を施した。

[0114]

得られたコーティング膜を有するフッ素ゴムシートを用いて、密着性、クラック性、お よび所定の寸法にカットした物で耐プラズマ性の試験を行った。その結果を表1に示す。

[0115]

実施例 2

基材として、参考例2で得られたフッ素ゴムシート(B)を用いた以外は、実施例1と 同様にし、厚さ $0.2 \mu m$ のアルミニウムのコーティング膜を施した。

[0116]

得られたコーティング膜を有するフッ素ゴムシートを用いて、密着性、クラック性、お よび所定の寸法にカットした物で耐プラズマ性の試験を行った。その結果を表1に示す。

[0117]

実施例3

参考例 1 で得られたフッ素ゴムシート (A) を、実施例 1 と同様の条件で洗浄し、洗浄 後の基材の表面にイオンプレーティング装置(成膜条件:蒸発材料 Al、放電電流 0A、Ar流量 40SCCM、O2流量 100SCCM、成膜圧力 0.59mTo rr) を用いて、厚さ0. 2μ mの酸化アルミニウムのコーティング膜を施した。

[0118]

得られたコーティング膜を有するフッ素ゴムシートを用いて、密着性、クラック性、お よび所定の寸法にカットした物で耐プラズマ性の試験を行った。その結果を表1に示す。

[0119]

実施例 4

基材として、参考例2で得られたフッ素ゴムシート (B) を用いた以外は、実施例3と 同様にし、厚さ $0.2 \mu m$ の酸化アルミニウムのコーティング膜を施した。

[0120]

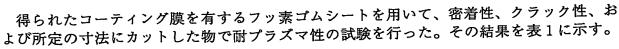
得られたコーティング膜を有するフッ素ゴムシートを用いて、密着性、クラック性、お よび所定の寸法にカットした物で耐プラズマ性の試験を行った。その結果を表1に示す。

[0121]

実施例 5

参考例1で得られたフッ素ゴムシート (A) を、実施例1と同様の条件で洗浄し、洗浄 後の基材の表面を、イオンプレーティング装置内にて、ガス条件Ar/O2=40SCC M/100SCCMで、AI材料が蒸発しない放電電流(約30A)、約5分のプラズマ アッシング処理をし、その後、イオンプレーティング法により(成膜条件:蒸発材料 A l、放電電流 40A、Ar流量 40SCCM、成膜圧力 0.26mTorr、加熱 なし)、厚さ0.2μmのアルミニウムのコーティング膜を施した。

[0122]



[0123]

実施例 6

基材として、参考例2で得られたフッ素ゴムシート (B) を用いた以外は、実施例5と 同様にし、厚さ $0.2 \mu m$ のアルミニウムのコーティング膜を施した。

[0124]

得られたコーティング膜を有するフッ素ゴムシートを用いて、密着性、クラック性、お よび所定の寸法にカットした物で耐プラズマ性の試験を行った。その結果を表1に示す。

[0125]

比較例1

参考例1で得られたフッ素ゴムシート (A) を用いて耐プラズマ性の試験を行った。そ の結果を表1に示す。

[0126]

比較例 2

参考例 2 で得られたフッ素ゴムシート (B) を用いて耐プラズマ性の試験を行った。そ の結果を表1に示す。

[0127]

【表1】

表 1

		1	~ -					
	実施例					比較例		
	1	2	3	4	5	6	1	2
ショアーA硬度	77	76	77	76	77	76	77	76
密着性-1(個/100個)	2	6	4	7	0	0		
密着性-2	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0		
クラック性	0	0	0	0	0	0		
酸素プラズマ性								
重量減少率(重量%)	< 0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	<0.01	0.93	2.29
表面粗度(Ra)	0.15	0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.45	0.59
Ra値の変化	- 0.03	-0.07	0.00	-0.03	0.00	- 0.03	0.27	0.38
CF4プラズマ性								
重量減少率(重量%)	<0.01	< 0.01	< 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.05	2.61
表面粗度(Ra)	0.13	0.14	0.17	0.18	0.18	0.20	0.41	0.57
Ra値の変化	-0.05	-0.07	- 0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.23	0.36
NF3プラズマ性								
重量減少率(重量%)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.53	0.07
表面粗度(Ra)	0.15	0.15	0.18	0.17	0.18	0.19	0.62	0.22
Ra値の変化	- 0.03	- 0.06	0.00	- 0.04	0.00	-0.02	0.44	0.01

【書類名】要約書一

【要約】

【課題】本発明は、表面コーティングされたシール材に関し、ゴム基材の持つ強度、硬度 、シール性を保ちつつ、耐薬品性、耐プラズマ性、非粘着性を高めたシール材を提供する

【解決手段】ショアD硬度が75以下かつショアA硬度が40~100である軟質材料か らなる基材の表面全体または一部に、金属、金属酸化物、金属チッ化物、金属炭化物およ びその複合物からなる群より選ばれる1種以上の金属または金属化合物からなるコーティ ング膜を有するシール材である。

【選択図】なし

特願2003-392172

出願人履歴情報

識別番号

[000002853]

1. 変更年月日

1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル

氏 名 ダイキン工業株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017085

International filing date: 17 November 2004 (17.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-392172

Filing date: 21 November 2003 (21.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.